

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/616,126	HEPP ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Scott M. Getzow_	3762	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
iplat	ed	10/24/06	S,		
			* ***		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		•			
	•				

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
I				
	T	T I		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
	-			
	•			
		_		
•				
	*			
·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·				
	1	l		